® 日本国特許庁(JP)

间特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 306745

@Int.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)12月14日

H 04 L 25/02 1/00

B-7345-5K D-8732-5K 302

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

の発明の名称

出力波形測定方法

20特 頭 昭62-143011

央

彰

②出 願 昭62(1987)6月8日

特許法第30条第1項適用 昭和62年3月15日 社団法人電子情報通信学会発行の「昭和62年電子情報 通信学会創立記念総合全国大会講演論文集」にて発表

②発 明 者 24 本

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

72.発 明者 学 内 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

②発 明 者 峠 逐 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

勿出 額 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

邳代 理 人 弁理士 玉蟲 久五郎

外1名

明 241

1.発明の名称 出力被形测定方法

2. 特許請求の範囲

(1) パルスパターン発生器のパルス個号を送信す る送信回路のパルス出力波形を所与の識別レベル と職別位相とによって識別して2億化出力を発生 する受信回路と、該受信回路の出力の符号誤り率 を測定する繰り検出器とを具えてなる出力波形料 価装置において、

等しい符号誤り率を与える前記識別レベルと識 別位相との組合せの点を結ぶ等符号誤り率曲線を 求める段階 (101)と、

該等符号誤り率曲線によって送信回路の出力波 形を評価する段階(102)と

を異えたことを特徴とする出力波形測定方法。 (2) パルスパターン発生器のパルス信号を送信する 送信回路のパルス出力波形を所与の観測レベルと 識別位相とによって識別して2値化出力を発生す

る受信回路と、該受信回路の出力の符号誤り率を 測定する誤り検出器とを具えてなる出力波形評価 装置において、

該パルスパターン発生器のパルス波形をPN信 号とワード信号とに変化したときの等しい符号誤 り率を与える前記職別レベルと識別位相との組合 せの点を結ぶ等符号誤り率曲線をそれぞれ求める 段階(103)と、

該輌等符号線り率曲線を比較して送信回路の出 力波形を評価する段階(104)と

を具えたことを特徴とする出力波形測定方法。

3.発明の詳細な説明

(概要)

送信出力を識別する受信回路において等符号棋 り率曲線を求めて、これによって送信波形の評価 を行うことによって、送信波形のアイオーブニン グの定量的な評価を行うことができるようにし、 また送信波形のパルス波形をPN信号とワード信 号とに変化したときの等符号誤り率曲線を求め、

これを比較して符号間干海量を測定することによって、超高速においても、符号間干渉を把握することができるようにすることによって、出力波形を正確に評価できるようにする。

〔産業上の利用分野〕

本発明は超高速光出力波形等を測定する方法に係り、特にアイオープニング等の出力波形の評価と符号間干渉量の把握を正確に行うことができる出力波形測定方法に関するものである。

超高速光通信装置等においては、システムの信頼性が極めて高いことが要求され、従って受信側における符号誤り率が十分低いことが必要となる。そのためには光出力波形に対しサンプリングオシロスコープを使用してアイパターンの観察を行い、アイオープニングから出力波形の評価を行うとともに、出力波形の観察から符号間干渉を測定して、送信回路および受信回路の調整を行うようにするが、この場合アイオープニングの評価を正しく行うことができるとともに、符号間干渉を正しく把

コープによる観測で光出力波形における符号間干 渉の測定を行おうとしても、測定器の性能上の限 界のためにその正確な把握を行うことが困難であ った。

(問題点を解決するための手段)

 握して、送信出力波形を正確に評価することができる出力波形測定方法が要望される。

〔従来の技術〕

従来、超高速光出力波形等を評価する場合には、 超高速光受信回路で受光し高速のサンプリングオ シロスコープを使用して波形を観測して、アイオ ープニングから目視によって光出力波形の評価を 行うとともに、光出力波形の観測から符号間干渉 の測定を行っていた。

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら実際の光出力波形のアイオープニングは、従来の測定法では正しく評価することができないことが判明した。すなわち符号誤り率が大きい場合にはアイパターンの観察によって符号誤り率を推測することができるが、符号誤り率が十分小さい状態では、アイパターンを観察しても符号誤り率との関連を知ることが困難である。

また超高速信号の場合、サンブリングオシロス

とワード信号とに変化したときの等しい符号誤り 率を与える識別レベルと識別位相との組合せの点 を結ぶ等符号誤り率曲線をそれぞれ求める設階 1 0 3 と、両等符号誤り率曲線を比較して送信回路 の出力波形を評価する段階 1 0 4 とを異えたもの である。

〔作 用〕

とができるようになる。

(実施例)

第2図は本発明が適用される出力波形評価装置 の構成を示したものである。同図においてパルス パターン発生器1は、測定のためのパルスパター ンを発生する。光送信回路2はパルスパターン発 生器1のパルスパターンを光信号として送信する ものであり、本発明の測定方法において測定の対 象とする被測定回路である。この場合、評価信号 のパルスパターンとしては、000000000 000111111111110RZ符号を用 いた。ビットレートは1.8Gb/sである。光 送信回路 2 の出力光は、光ファイバ 3 を介して光 アッテネータ4に導かれ、光アッテネータ4にお いて所要の減衰を受け、光アッテネータ4の出力 光はさらに光ファイバラを介して光受信間路6に 加えられる。光受信回路6は、光一電気変換等化 増幅器7、識別回路8、タイミング抽出回路9を 含んでいる。光一箇気変換等化増幅器では光入力

信号を電気信号に変換し、所要の等化特性により 等化と増幅とを行って等化信号出力 A を発生する。 光一電気変換等化増幅器 7 の出力信号の一部は選 延回路 10 を経て遅延される。タイミング抽出回路 9 は、遅延回路 10 の出力信号からタイミング信号 を抽出し、等化信号出力 A に対して遅延回路 10 で 定まる位相角 8 を育するタイミング信号を出力す る。識別回路 8 は光一電気変換等化増幅器 7 の出 力に対し、識別レベル V thを B値として位相角 8 のタイミング信号によって識別を行って 2 値化された出力信号を発生する。 識別回路 8 の出力信号 は誤り検出器 11 に加えられて、符号誤り率を測定 される。

(1) 第1の実施例

第2図に示された測定装置による出力波形の評価は、次の手順によって所与の符号誤り率Pe1の等符号誤り率曲線を測定することによって行われる。

・ 識別函路 8 における識別タイミング位相 θ と 識別レベル V thとを適当に設定し、符号誤り率 P

01以下となる点を見出す。

いま第3図に示すように、第2図のA点における等化波形において、このような点が求められた ときの位相 θ , レベルV thをそれぞれ θ o, V tho

- ② この状態で位相 θ を変化させて、符号繰り率 M = 1 以上となる位相 θ , θ , θ , θ 。 の 範囲について見出す。
- ③ 第4図に示すように、位相のを θ 1°より後小値 Δ 0°ずつ増加しながら符号誤り率を測定し、Pelを過るときの位相のを θ 1とする。
- ® 再び位相 θ を変化させて、符号額 θ 率が P e 1 以上となる位相 θ 2 θ 2 θ > θ 0 範囲について見出す。
- ⑤ 第4図に示すように、位相のを θ 2'より微小値 Δ 6 ずつ減少しながら符号類り率 P6 を測定し、P6 1 を過るときの位相のを θ 2 とする。
- ⑤ 次に識別レベル V thを微小値 Δ V thだけ増加する。
- の 符号誤り率がPel以下となる位相θがあれ

ば、これを θ o とおいて、上述の②~⑤の手順を 繰り返す。

- ⑤ 識別レベル V thを減少させる方向についても 同様に、②~⑦の手順を行う。
- ⑤ ⑤、⑤で求めた位相θ 1 . θ 2 をすべて結んで、第 5 図に示すように符号銀り率 P e 1 の等符号銀り率曲線を得る。

このようにして求められた符号誤り率Pelの 等符号誤り率曲線は、第3図においてBで示すように等化波形のアイパターンにおけるアイオープニングの内部に描かれ、識別レベルVthと識別タイミング位相のとのある組合せの点の位置がこの曲線の範囲内であれば、そのときの符号誤り率がPel以下となることが保証されることをのになる。

そしてこのようにして求められた等符号誤り率 曲線によって、所与の送信団路出力波形を受信回 路において識別して、所定の符号誤り率を得よう とする場合の識別レベルV thと識別タイミング位 相のとの選定範囲を定めることができる。

また送信回路の調整時においては、このように して求められた等符号誤り率曲線の占める面積が なるべく大きくなるように送信回路の調整を行う ことによって、送信波形の品質をより向上させる ことができる。特にアイパターンの観察のみによ っては不可能な低い符号誤り率時の送信回路の調 整に際して有効である。

さらに種々の符号誤り率について等符号誤り率 曲線群を求めることによって、受信側で最良の符 号誤り率によって受信を行うようにすることがで きるとともに、送信側の調整において等符号誤り 率曲線群の形状によって、符号誤り率劣化の原因 を推定することもある程度可能である。

(2) 第2の実施例

第2図に示された測定装置による符号間干渉の 把握は、次の手順によって異なるパルス波形の光 入力信号に強対する、一定の符号誤り率における 等符号誤り率曲線を求めて、これを比較すること によって行うことができる。

グオシロスコープによる観測では、符号間干渉の 定性的な評価しか行うことができず、超高速光通 信システムにおいて必要とされる特性を満足して いるか否かを知ることは困難であったが、本発明 の方法では定量的な評価ができ、サンプリングオ シロスコープによる目視の観測では測定困難であ った、僅かな符号間干渉も正確に把握することが できるようになる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明の出力波形測定方法によれば、送信出力波形のアイオープニングを正しく評価することができるとともに、出力波形の符号間干渉を正確に把握することができるので、出力波形の評価を正しく行うことができ、特に超高速光送信回路および受信回路の調整と評価を行う上で極めて効果的である。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理的構成を示す図、

(a) パルスパターン発生器1でPN信号(ランダムパターン)を発生させ、前述の①~③の手順によって符号誤り率Pe1について等符号誤り率曲線弾を求める。

(b) バルスパターン発生器1でワード信号(例えば1,0の繰り返しのパターン)を発生させ、前述の①~⑤の手順によって符号誤り率Pelについて等符号誤り率曲線群を求める。

(c) 上述の(a)、(b)の測定結果を比較して、第6図に示すようにワード信号に対する等符号級り率曲線 Cの最大の開き b と、P N信号に対する等符号級り率曲線 Dの最大の開き a とから (b-a) / b を求める。

このようにして求められた比(b-a)/bは、ワード信号に対するPN信号のアイ劣化を表し、これによって光送信回路出力波形における符号間干渉を評価することができる。

このようにして出力波形における符号間干渉の 定量的な評価を行うことによって、出力波形の正 確な評価を行うことができる。 従来のサンプリン

第2図は本発明が適用される出力波形評価装置 の機成を示す図、

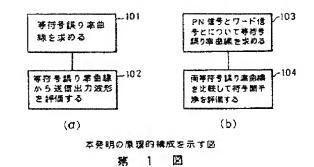
第3 図は等化出力波形と識別レベルおよび識別 タイミング位相を示す図、

第4図は等しい符号額り率を得る識別タイミン グ位相を求める手類を示す図、

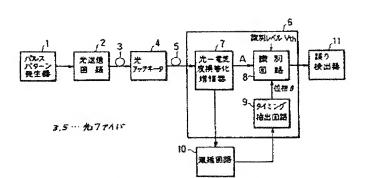
第5 図は等符号誤り率曲線を示す図、

第6 図はワード信号に対する等符号誤り率曲線とその最大の開きおよびPN信号に対する等符号 誤り率曲線とその最大の開きとを示す図である。

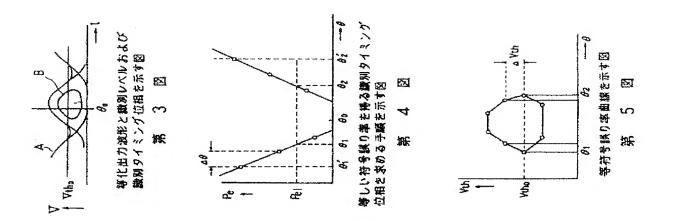
- 1 …パルスパターン発生器
- 2 一光送信回路
- 3. 5…光ファイバ
- 4…光アッテネータ
- 6 …光受信回路
- 7 -- 光 電気変換等化增幅器
- 8 … 临別回路
- 9 …タイミング抽出回路
- 10 -- 遊延回路

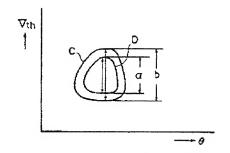


特許出願人 富士 通 株 式 会 社 代理人 弁理士 玉蟲久五郎(外1名)



本発明が適用される出力被形評価装置の構成を示す図 第 2 図





ワード信号に対する等符号誤り率曲線とせの最大の開きおよび PN信号に対する等符号誤り率曲線とての最大の開きとを示す図

第 6 図